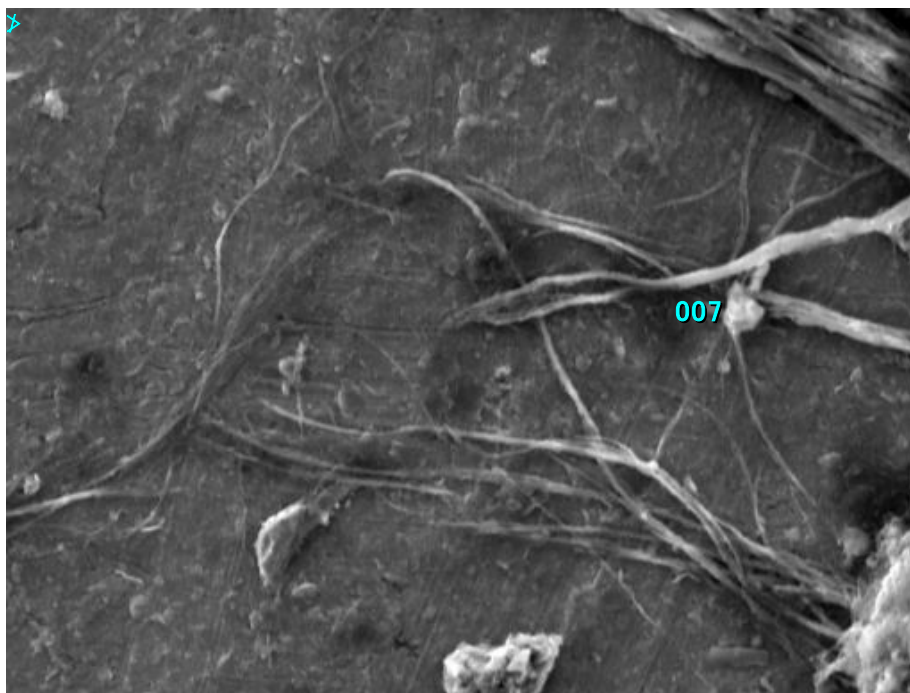


組成分析等

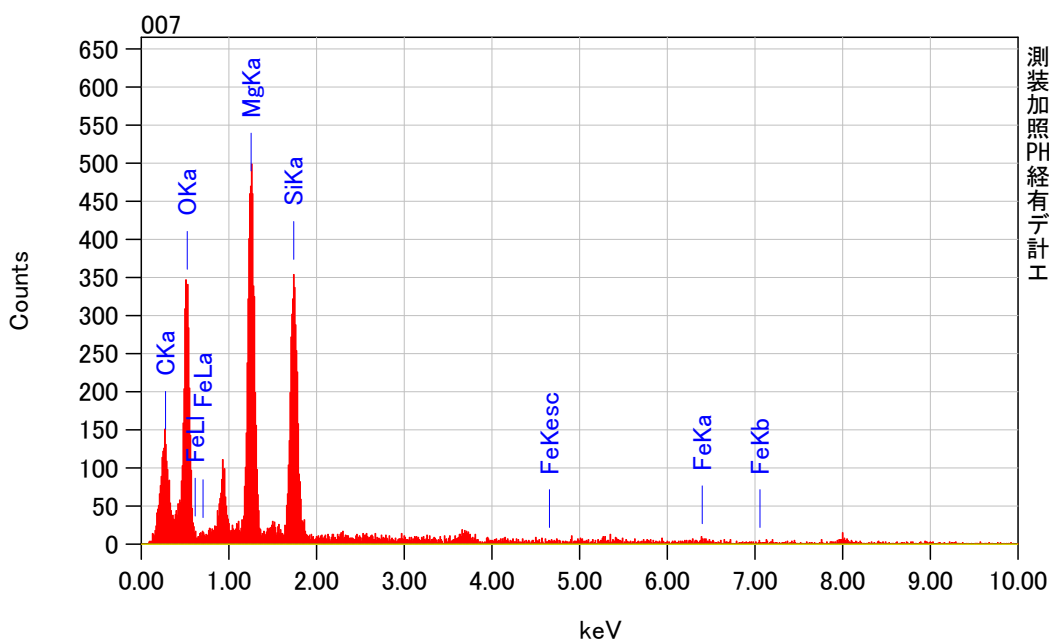
SEM/EDS (最大 30 万倍、分析元素 C~U)



材料の観察・組成分析等に威力を発揮するSEM/EDS (JSM-6390、Dry-EDX 付き)



タイトル : IMG1
 装置 : 6390 (LA)
 加速電圧 : 15.00 kV
 倍率 : x 1,000
 測定日時 : 2016/12/01
 画素数 : 512 x 384

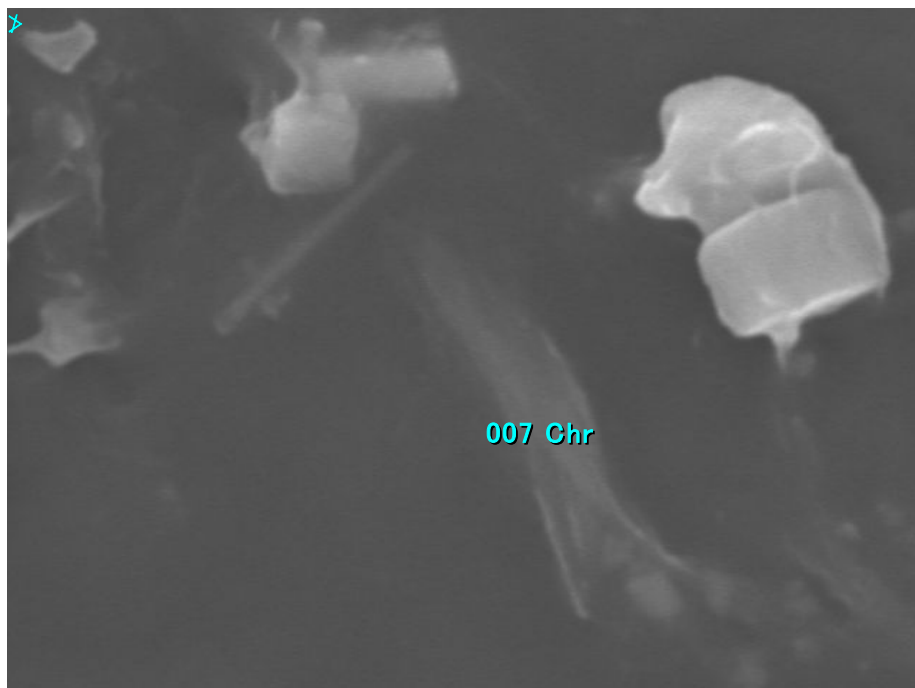


測定条件
 装置名 : 6390 (LA)
 加速電圧 : 15.0 kV
 照射電流 : 1.00000 nA
 PHAモード : T3
 経過時間 : 3.39 sec
 有効時間 : 3.24 sec
 デッドタイム : 4 %
 計数率 : 6253 cps
 エネルギー範囲 : 0 - 20 keV

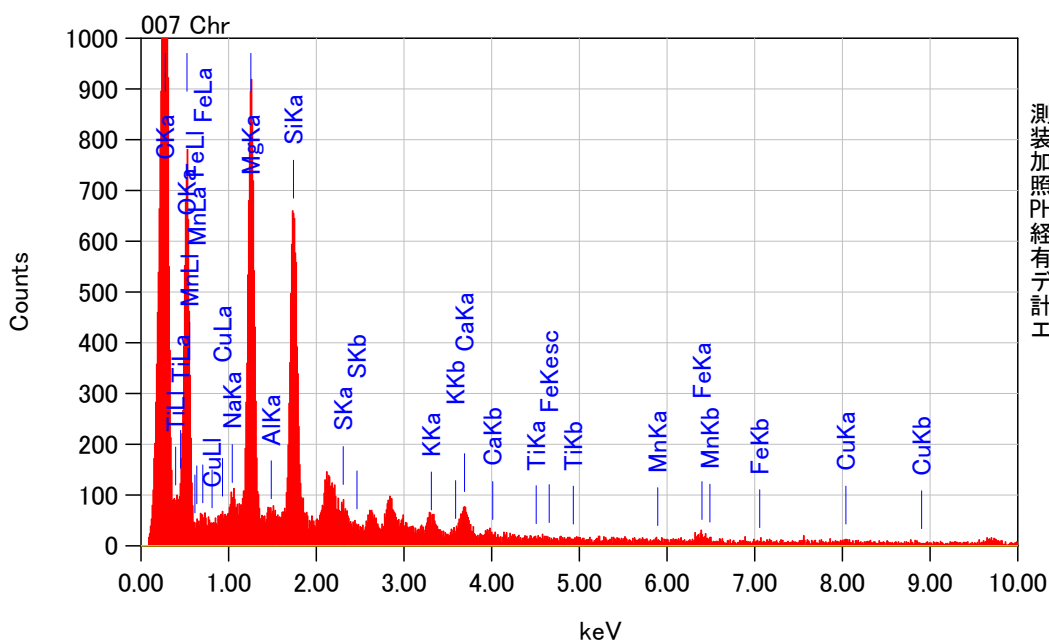
ZAF法 簡易定量分析(酸化物)
 フィッティング係数 : 0.3225
 全酸素数 : 24.0

元素	(keV)	質量%	誤差%	モル%	化合物	質量%	カチオン数	K
C K	0.277	23.38	0.18	55.46	C	23.38	0.00	11.6693
O		35.48						
Mg K	1.253	21.58	0.24	25.29	MgO	35.78	9.61	45.5128
Si K	1.739	18.38	0.42	18.65	SiO2	39.32	7.08	40.0479
Fe K	6.398	1.18	1.43	0.60	FeO	1.52	0.23	2.7700
合計		100.00		100.00		100.00	16.92	

クリンタイトル



タイトル : IMG2
 装置 :
 加速電圧 : 20.00 kV
 倍率 : x 5,000
 測定日時 : 2008/08/04
 画素数 : 640 x 480



測定条件 :
 装置名 : 6390 (LA)
 加速電圧 : 20.0 kV
 照射電流 : 1.00000 nA
 PHAモード : T3
 経過時間 : 15.51 sec
 有効時間 : 15.00 sec
 デッドタイム : 3 %
 計数率 : 4037 cps
 エネルギー範囲 : 0 - 20 keV

ZAF法 簡易定量分析

フィッティング係数 : 0.3475

元素	(keV)	質量%	誤差%	原子数%	化合物	質量%	カチオン数	K
C	0.277	46.68	0.09	57.21				31.3956
O	0.525	36.45	0.39	33.54				40.5886
Na	1.041	0.70	0.15	0.45				1.1177
Mg	1.253	8.57	0.12	5.19				12.0258
Al	1.486	0.16	0.12	0.09				0.2308
Si	1.739	5.42	0.11	2.84				9.6767
S	2.307	0.17	0.09	0.08				0.3944
K	3.312	0.41	0.13	0.15				0.9703
Ca	3.690	0.67	0.15	0.25				1.6814
Ti								
Mn	5.894	0.05	0.34	0.01				0.1082
Fe	6.398	0.56	0.35	0.15				1.1381
Cu	0.930	0.16	0.10	0.04				0.6724
合計		100.00		100.00				